

Prüftechnik für die industrielle Praxis

14.02.2008 in der ZENTEC, Großwallstadt

Programm:

13:00 Uhr	Beginn Ausstellung
14:00 Uhr	Begrüßung
14:10 Uhr	Vom Labor in den Gerichtssaal: Wie moderne Analytik bei der Verbrechensbekämpfung hilft Dr. Gabriele Gorzawski, Bundeskriminalamt
15:00 Uhr	Ziel-Ionenstrahlpräparation für die Nanoanalytik Dr. Jürgen Meinhardt, Analytisches Dienstleistungszentrum des Fraunhofer-Institut für Silicatforschung
15:20 – 15:50 Uhr	Kaffeepause
15:50 – 16:10 Uhr	Prüfung der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie der Elektromagnetischen Verträglichkeit bei der Entwicklung und Fertigung elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Michael Kaloudis, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bochtler, Hochschule Aschaffenburg
16:10 – 16:30 Uhr	Dauerbelastungs- und Umweltsimulationsprüfungen an Automobil-Innenraumkomponenten Dr. Peter Placke, TRW Prüflabor
16:30 – 16:50 Uhr	Schadensfallanalytik in der industriellen Praxis Dr. Wolfgang Lohmann, Analytik Service Obernburg (Mainsite GmbH & Co. KG)"
16:50 – 17:10 Uhr	Möglichkeiten für mittelständische Unternehmen zur Steigerung der Materialeffizienz mittels des Förderprogramms „DEMEA“ des BMWi Holger Korn, Korn Consult
17:10 Uhr	Diskussion und Imbiss